# Si基板上エピタキシャル(K,Na)NbO。系薄膜の圧電特性

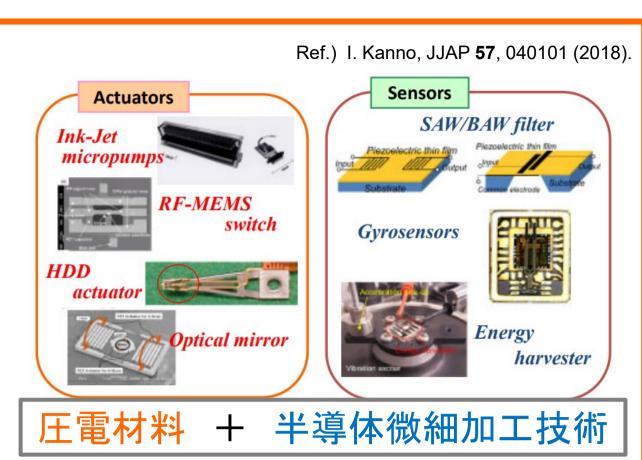
神戸大学1,大阪公立大学2

〇田中清高1, 小川 零1, 何 京瑋1, 權 相暁1, 譚ゴオン2, 神野伊策1



#### 研究背景

非鉛圧電材料として高いキュ リー温度(T<sub>c</sub>~420℃)と優れ た圧電特性(d<sub>33</sub>~160pC/N) を示すニオブ酸カリウムナトリ ウム(K,Na)NbO<sub>3</sub>(KNN)系が 注目され、振動発電素子や圧 電 MEMS ( Micro Electro Mechanical Systems) ~ 0 応用が期待されている。



PZT系圧電薄膜 半導体微細加工 に適した基板 の非鉛化

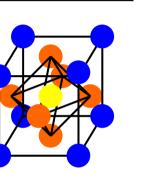
#### Si基板 KNN Si基板上のKNN薄膜の報告例

	成膜法	結晶性 基板	膜厚	高い電特を 示すNa比	圧電定数 比誘電率	文献
名工大 柿本研	ゾルゲル	多結晶薄膜(一軸配向) (111)Pt/Ti/SiO <sub>2</sub> / <mark>Si</mark>	250nm	0.527 (Na/K=58/52)	— 725	<b>K. Tanaka</b> <i>et al</i> ., JJAP <b>46</b> , 6964 (2007).
名大 余語研	ゾルゲル	多結晶薄膜(ランダム) (111)Pt/TiOx/SiO <sub>2</sub> / <mark>Si</mark>	600nm	0.55	d <sub>33</sub> =46 (pm/V) 540	Y. Nakashima <i>et al</i> ., JJAP <b>46</b> , L311 (2007).
日立電線 ( <sub>現</sub> 住友化学)	スパッタ	多結晶薄膜(一軸配向) (111)Pt/Ti/SiO <sub>2</sub> / <mark>Si</mark>	3µm	0.44	e <sub>31,f</sub>  =5.5 (C/m <sup>2</sup> ) 598	K. Shibata <i>et al</i> ., APEX <b>1</b> , 011501 (2008).
	7/199	エピ <mark>タキシャル薄膜</mark> (001)Pt/MgO	3µm	0.38	e <sub>31,f</sub>  =3.6 (C/m²) <b>185</b>	
日立電線 ( <sub>現</sub> 住友化学)	スパッタ	多結晶薄膜(001優先) (111)Pt/Ti/SiO <sub>2</sub> / <mark>Si</mark>	3µm	0.55	e <sub>31,f</sub>  =14.4 (C/m <sup>2</sup> ) 1,100	K. Shibata <i>et al</i> ., JJAP <b>50</b> , 041503 (2011).
Twente大	PLD	多結晶薄膜(100優先) (111)Pt/Ti/SiO <sub>2</sub> /SOI	750nm	0.50	e <sub>31,f</sub>  =5.6 (C/m <sup>2</sup> )	M.D. Nguyen <i>et al</i> ., Mater. Lett. <b>164</b> , 413 (2016).
神戸大 神野研	スパッタ	エピタキシャル薄膜 (001)SrRuO <sub>3</sub> /Pt/ZrO <sub>2</sub> /Si	1.5µm	0.53	e <sub>31,f</sub>  =6.5 (C/m <sup>2</sup> ) <b>267</b>	<b>K. Tanaka</b> <i>et al.</i> , APL <b>121</b> , 172901 (2022).

振動発電性能指数:FOM  $FOM = \frac{\left(e_{31,f}\right)^2}{}$ 

振動発電素子の高性能化

高い圧電特性

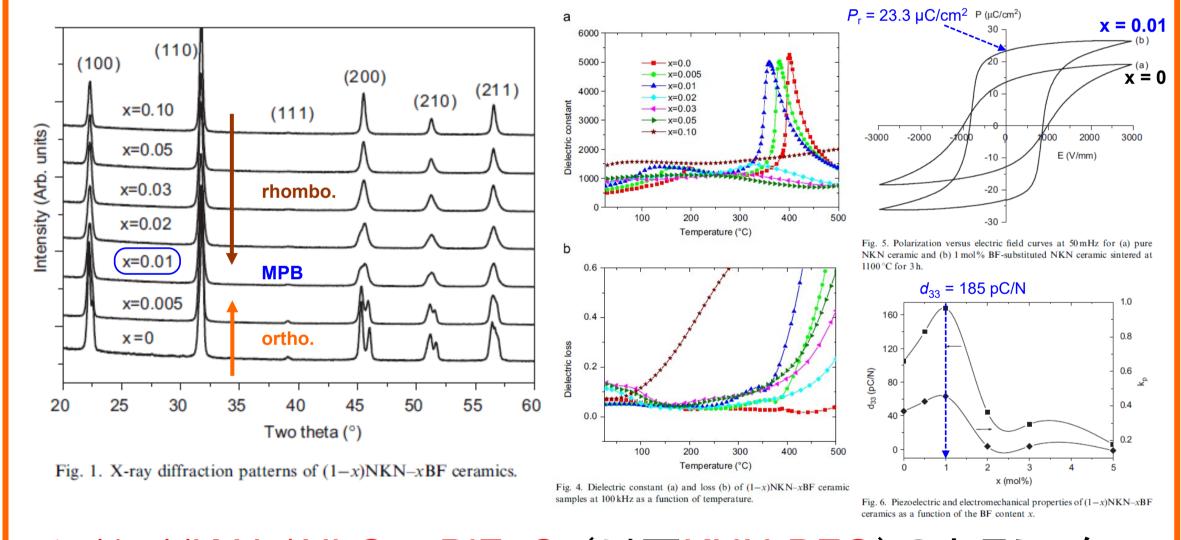


我々はスパッタ法でSi基板上に作製したエピタキシャルKNN薄膜 を作製し、その誘電・圧電特性をこれまで報告してきた。

## KNN薄膜の特性向上のために...

①Na/(K+Na)比の最適化 K. Shibata et al., JJAP 50, 041503 (2011). ②ポストアニール K. Tanaka et al., APL 121, 172901 (2022). ③バッファ層の導入 田中ら, 春季応用物理学会, 17p-PA06-8 (2023).

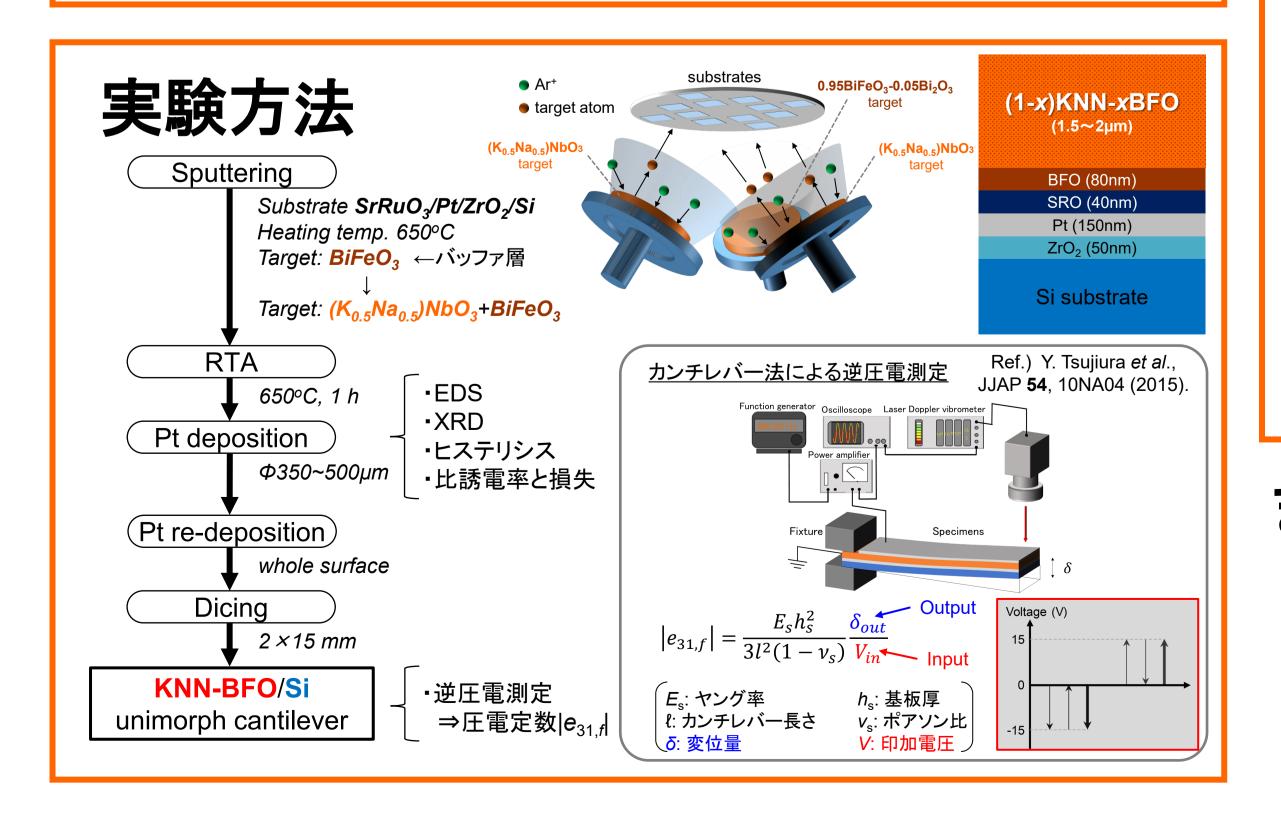
#### 4他元素との固溶体 R. Zuo et al., Journal of Physics and Chemistry of Solids, 69, 230 (2008).



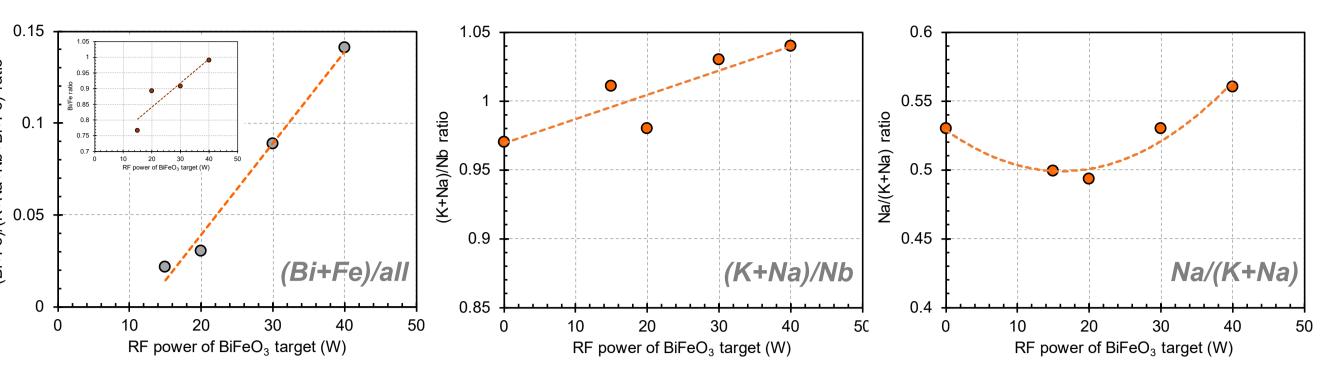
- ➤ (1-x)(K,Na)NbO<sub>3</sub>-xBiFeO<sub>3</sub>(以下KNN-BFO)のセラミックス では, x=0.01で圧電定数d<sub>33</sub>が185(pC/N)まで増加。
- ▶斜方晶系KNNと菱面体晶系BFOによるMPB組成 (morphotropic phase boundary)が存在すると報告。

#### 研究目的

圧電特性の向上を目指し, 膜厚1.5~2µmのエピタキシャル (1-x)KNN-xBFO薄膜をスパッタ法でSi基板上に作製し、結 晶構造や誘電・圧電特性の組成依存性を検証する。



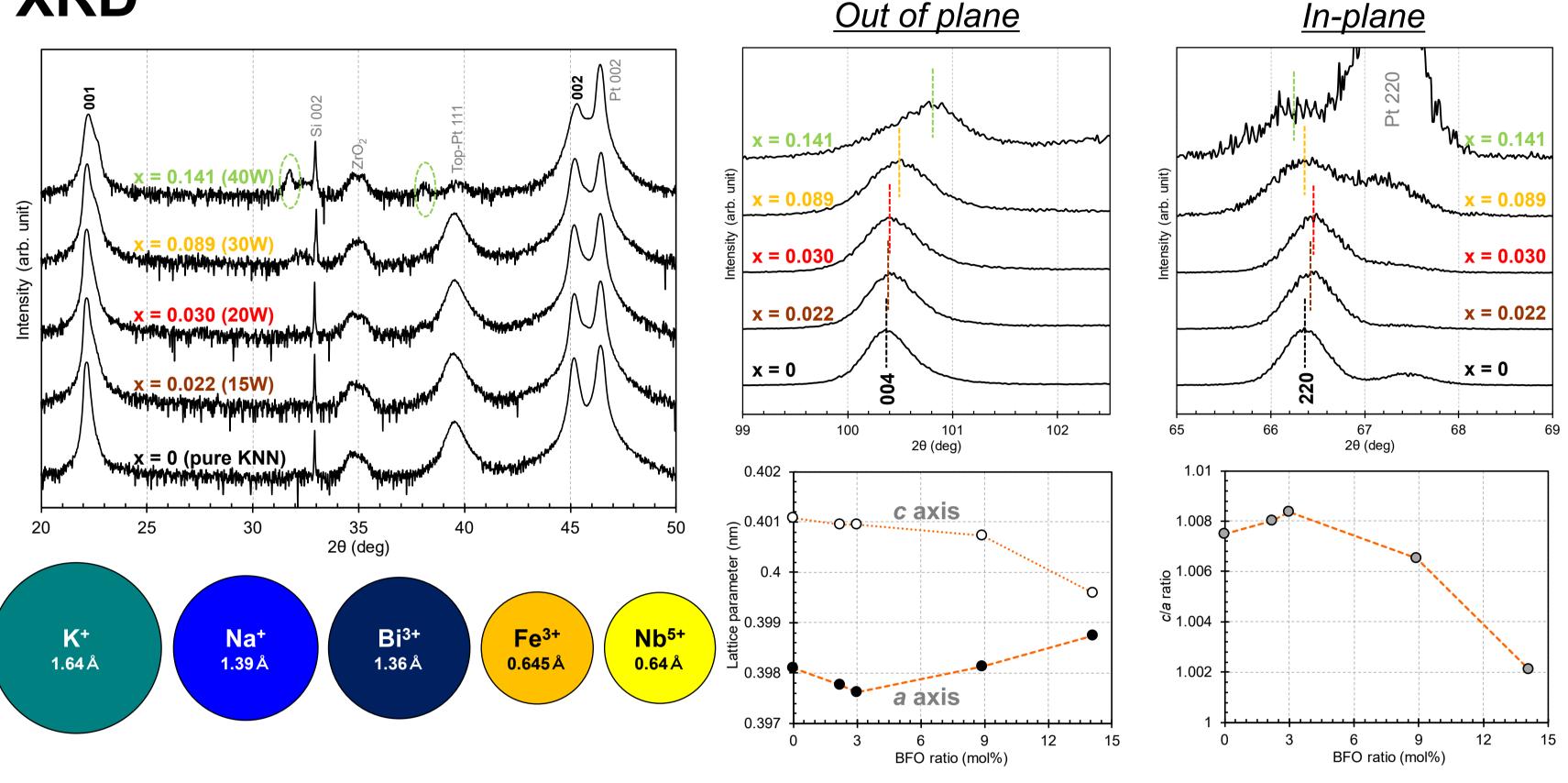
### 表面組成比(EDS)



➤ BFOターゲットの出 力制御によって, BFO量が0.022~ 0.141に変化 ➤ (K+Na)/Nb比は

0.97~1.04 ➤ Na/(K+Na)比は 0.49~0.56

# **XRD**

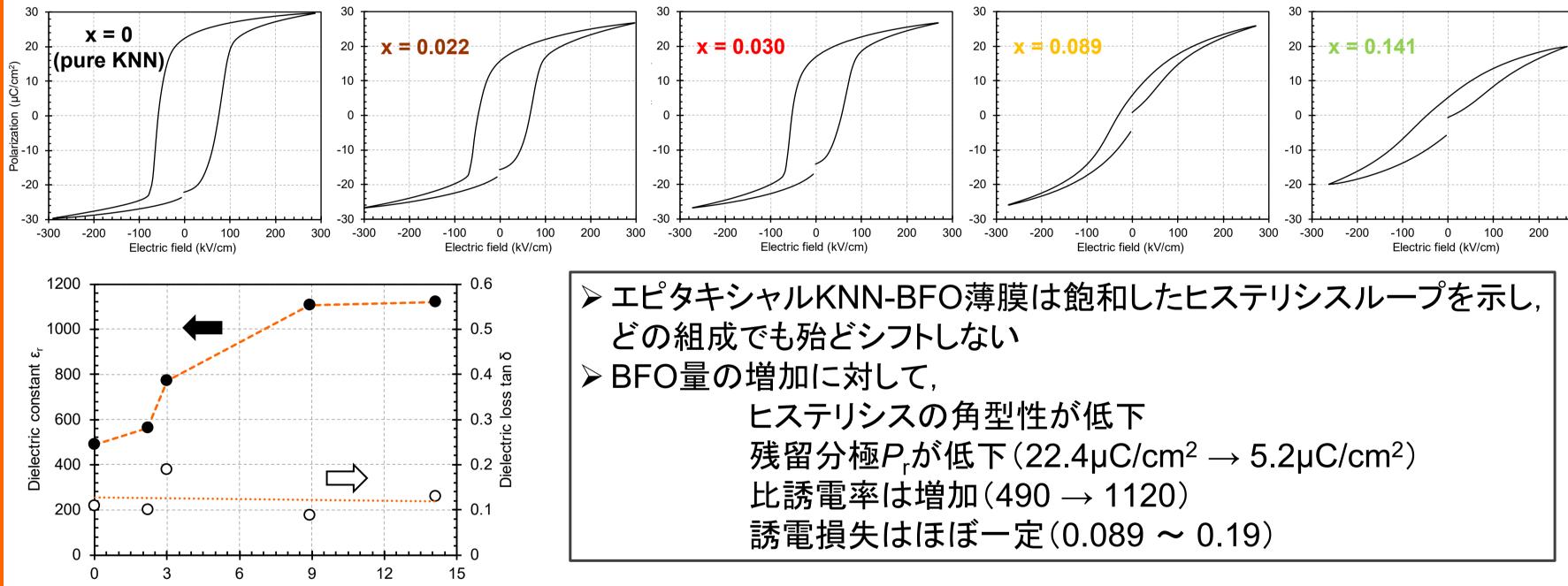


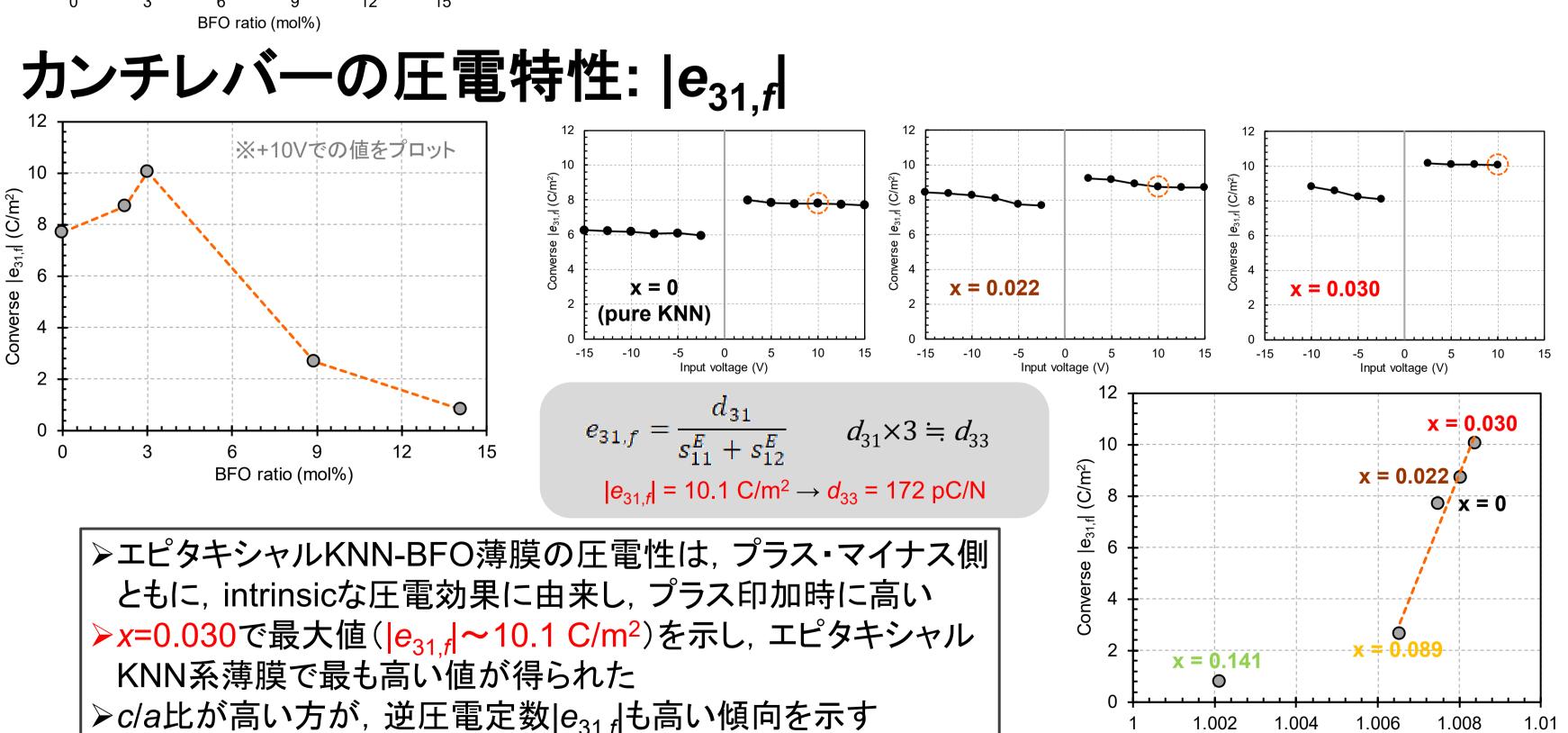
- ➤ バッファ層付きSi基板上にKNN-BFO薄膜がエピタキシャル成長
- > x=0.141(40W)で二次相が存在 ⇒x=0.089(30W)までBiとFeがKNNに固溶
- ▶ BFO量の増加に対して、

Out of planeの004ピークが高角側にシフト ⇒c軸が減少 In-planeの220ピークがx=0.030(20W)まで高角側にシフトし、その後低角側にシフト ⇒a軸がx=0.030まで減少し、その後増加

面外/面内格子定数比c/aはx=0.030でピークを示す(c/a=1.0084)

## P-Eヒステリシスループ(10kHz)と誘電特性





## まとめ

- ➤ スパッタによりSi基板上にエピタキシャル(1-x)KNN-xBFO固溶薄膜を作製し 誘電・圧電特性を評価した。
- ➤ 逆圧電効果による圧電定数|e<sub>31 f</sub>|は, x=0.030の時に最大10.1 C/m<sup>2</sup>を示した。 現時点でこの値はSi基板上エピタキシャルKNN系薄膜で最も高い。
- $> |e_{31}|$  は結晶構造の面外/面内格子定数の比率であるc/aに依存し、c/a比が 更に大きなKNN-BFO薄膜が得られれば、 $|e_{31}|$ の更なる向上が期待できる。



c/a ratio